

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Record Nr. | UNINA990001730770403321 |
| Autore | Ippolito, Girolamo |
| Titolo | La Stazione sperimentale di Foggia per l'epurazione ed utilizzazione delle acque di fogna nel periodo dal 1 novembre 1935 al 30 ottobre 1938 / Girolamo Ippolito, Guido Gesue |
| Pubbl/distr/stampa | Roma : Ed. Italia, 1939 |
| Descrizione fisica | 48 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 628.16 |
| Locazione | FAGBC |
| Collocazione | 60 OP. 37/45 |
| Lingua di pubblicazione | Italiano |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| 2. Record Nr. | UNINA9910483753103321 |
| Titolo | Reversible Computation : 9th International Conference, RC 2017, Kolkata, India, July 6-7, 2017, Proceedings // edited by Iain Phillips, Hafizur Rahaman |
| Pubbl/distr/stampa | Cham : , : Springer International Publishing : , : Imprint : Springer, , 2017 |
| ISBN | 3-319-59936-4 |
| Edizione | [1st ed. 2017.] |
| Descrizione fisica | 1 online resource (XII, 255 p. 98 illus.) |
| Collana | Programming and Software Engineering, , 2945-9168 ; ; 10301 |
| Disciplina | 004 |
| Soggetti | Logic design
Computer input-output equipment
Computer storage devices
Memory management (Computer science)
Artificial intelligence
Software engineering
Computer networks
Logic Design
Input/Output and Data Communications
Computer Memory Structure
Artificial Intelligence
Software Engineering |

Computer Communication Networks

Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references and index.
Sommario/riassunto	This book constitutes the refereed proceedings of the 9th International Conference on Reversible Computation, RC 2017, held in Kolkata, India, in July 2017. The 13 full and 5 short papers included in this volume together with one invited paper were carefully reviewed and selected from 47 submissions. The papers are organized in the following topical sections: foundations; reversible circuit synthesis; reversible circuit optimization; testing and fault tolerance; and quantum circuits.